

УДК 620.18(075)  
ББК 30.3я73  
Р59

Рецензенты:

*Н. А. Хмырова*, канд. физ.-мат. наук,  
доцент кафедры «Физика и химия» ОмГУПС;

*С. Н. Несов*, канд. физ.-мат. наук,  
научный сотрудник ОНЦ СО РАН

**Рогачев, Е. А.** Физические основы современных методов исследования материалов : учеб. пособие / Е. А. Рогачев ; Минобрнауки России, Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2021. – 1 CD-ROM (2,82 Мб). – Систем. требования: процессор с частотой 1,3 ГГц и выше ; 256 Мб RAM и более ; свободное место на жестком диске 300 Мб и более ; Windows XP и выше ; разрешение экрана 1024×768 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8149-3367-6.

Рассмотрены физические процессы, законы и явления, лежащие в основе различных методов исследования материалов, таких как сканирующая зондовая микроскопия, растровая электронная микроскопия, ИК-спектроскопия, рентгеновская дифрактометрия и др. Представлен материал для самостоятельной работы в виде практических заданий.

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обучающихся по специальностям, связанным с проектированием оборудования и разработкой специальных технологий создания новых материалов.

Редактор *Т. А. Москвитина*

Компьютерная верстка *Л. Ю. Бутаковой*

*Для дизайна этикетки использованы материалы  
из открытых интернет-источников*

---

Сводный темплан 2021 г.

© ОмГТУ, 2021

Подписано к использованию 29.10.21.

Объем 2,82 Мб.